

Single Diode

Super Fast Recovery Diode

D2FK60

600V 1.5A

特長

- 小型SMD
- 高耐圧
- trr=75ns
- 低VF=1.3V

Feature

- Small SMD
- High Voltage
- trr=75ns
- Low VF=1.3V

用途

- スイッチング電源
- DC/DC コンバータ
- 家電、OA
- 通信
- フライホール

Main Use

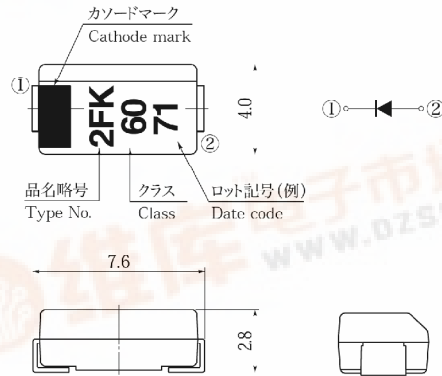
- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Home Appliance, Office Automation
- Communication
- Fly Wheel

■ 外観図 OUTLINE

Package : 2F

Unit:mm

Weight 0.16g(Typ)



外形図については新電元Webサイト又は〈ダイオードカタログ・技術資料編〉を参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or the diode technical data book. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■ 定格表 RATINGS

● 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_l = 25^\circ\text{C}$)

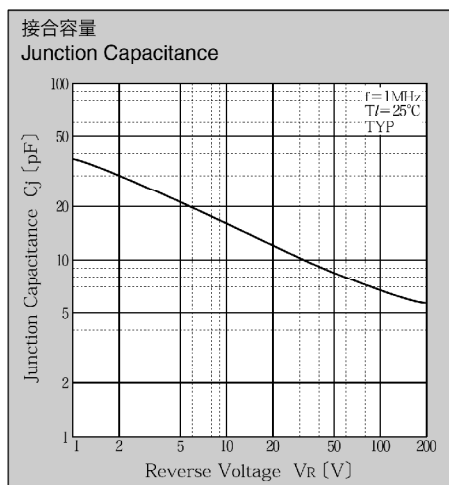
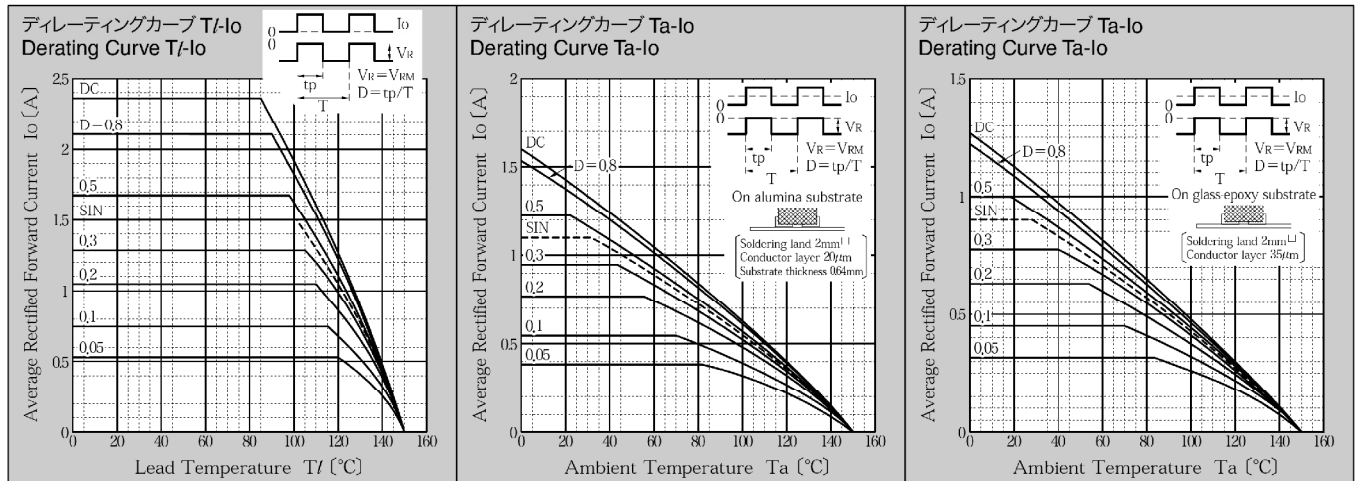
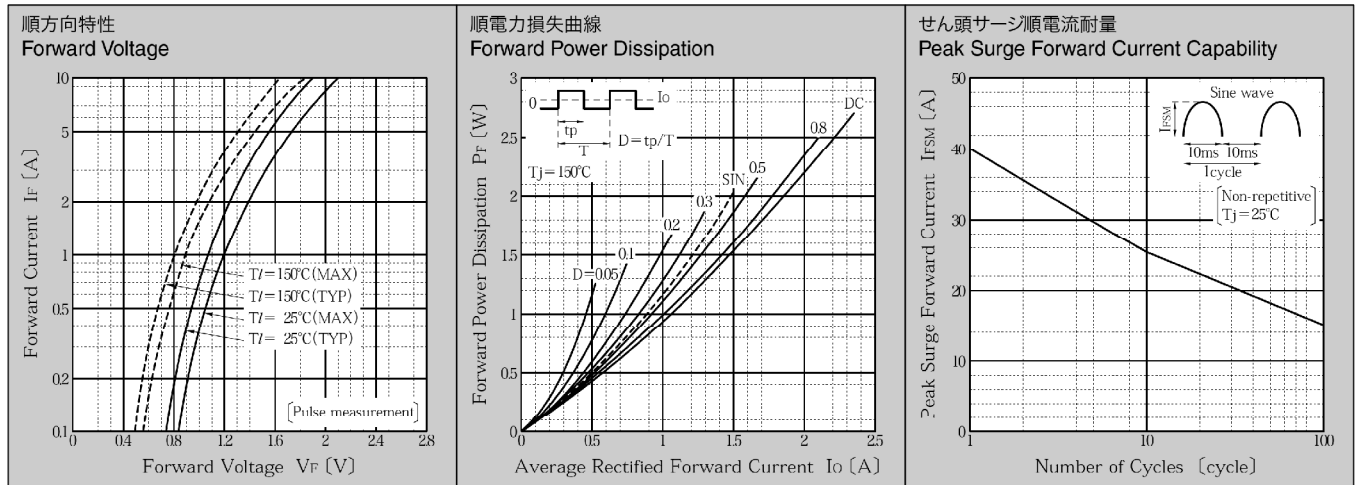
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D2FK60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	T _l = 101℃	1.5	A
			T _a = 30℃ アルミナ基板実装 On alumina substrate	1.1	
			T _a = 28℃ プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	0.9	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T _j = 25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T _j = 25℃		40	A

● 電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_l = 25^\circ\text{C}$)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 1.5A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 1.3	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = V _{RM} , パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	I _F = 0.5A, I _R = 1.0A, 0.25I _R	MAX 75	ns
接容量 Junction Capacitance	C _j	f = 1MHz, V _R = 10V	TYP 16	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jl}	接合部・リード間 Junction to lead	MAX 24	℃/W
	θ _{ja}	接合部・周囲間 Junction to ambient	MAX 90	
			MAX 120	



■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
 Typical is a statistical average of the device's ability.
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 Typical is a statistical average of the device's ability.